#### LG AI연구원 - AI SUMMIT

# The State-of-the-Art in Deep Learning for Process Innovation



김승환 Vision 랩장

LG Al Research

#### Al for a Better Life

우리는 인간과 AI의 시너지를 기반으로 인간의 삶에 도움을 주는 AI를 개발하고자 합니다.

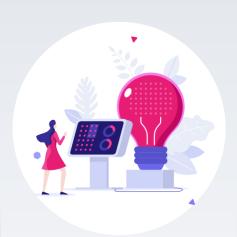


#### Al for LG

LG는 인간과 AI의 시너지를 기반으로 고객 가치를 제고하고 기업 내 다양한 업무에 활용되는 AI를 개발하고 있습니다.











Data Driven	
<b>Business Decision</b>	

Demand Forecast

Sales Forecast

Material Price Forecast

#### Optimized R&D

Molecular Information DB

Cancer Drug

OLED Emitter Materials

#### Smart Manufacturing

Production Optimization

Battery Capacity Prediction

Process Diagnosis

#### Efficient Quality Assurance

Vision Inspection

#### Intelligent Customer Care

Chatbot
STT Solution
Service Failure Prediction



#### **Vision Research**

Vision Al Core 선행 기술 연구 및 Image/Video Data 기반 그룹 난제 해결을 통해 사업적 성과를 창출합니다.

#### **Core Tech**

- Contrastive Learning
- Continual Learning
- Active Learning
- Few-shot Learning
- Explainable AI
- Graph Neural Network
- Vision Transformer
- Generative Model
- Neural Rendering

----

#### **Applications**



**AI 기반 차세대 Vision 검사 개발** (데이터 생성, 분류, 결과 설명 등 포함)



**인간처럼 자연스러운 디지털 휴먼** (말하기, 표정, 제스처 등)



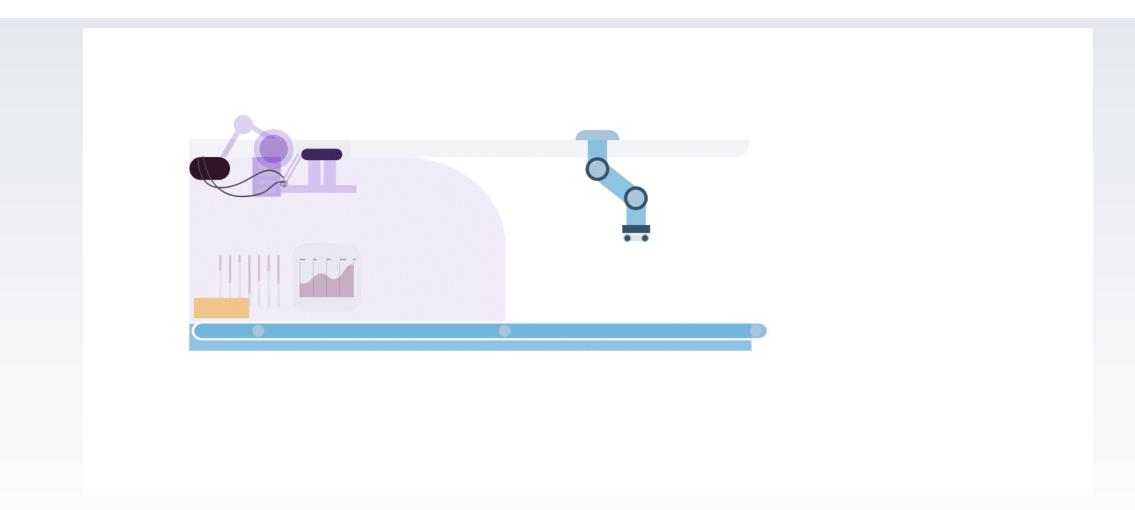
**논문 / 특허 문서 내 분자 정보 DB화** (이미지 분자 구조 인식)



**Generative Model** 



비전검사란 제품 외관에 발생된 결함을 판정하는 것으로 제품의 품질을 관리합니다.

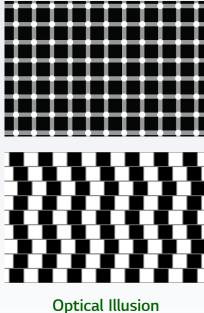




Manual Inspection은 사람에 따라 불량 판단 기준이 다르며, 검사 속도가 느리고 비효율적입니다.

- Human vision alone is undependable
  - 주변 조형물에 의해 착시 현상 받생 (Optical Illusion)
- Imprecision of eyesight
  - 사람의 눈은 품질을 정량적으로 측정하기 어려움
- Cost of labor
  - 검사원이 숙련될수독 비용 증가



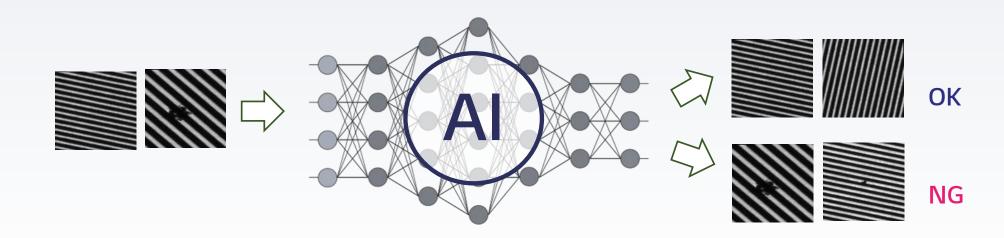




Al기술은 일정한 판단 기준으로 빠르고 효율적인 비전검사를 가능하게 합니다.

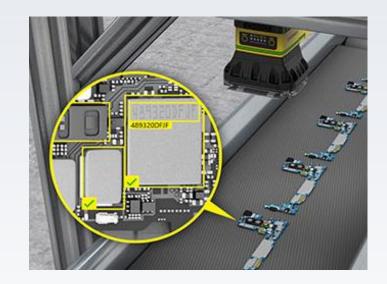
- Faster
  - 컴퓨팅 파워에 따라 빠른 검사 처리 가능
- Accurate
  - 딥러닝 모델을 학습하여 높은 정확도로 검사

- Reliable
  - 학습된 기준에 따라 일정하게 분류
- Independent of Environment
  - 위험한 환경에서도 검사 가능





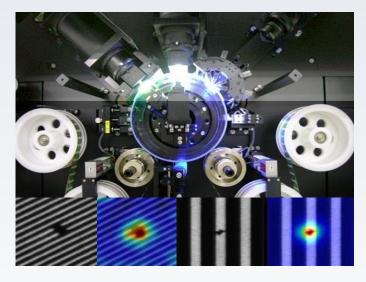
Al 비전검사 기술이 다양한 산업의 생산 공정에 적용되는 사례가 증가되고 있습니다.



PCB 조립검사



자동차 부품결함 검사

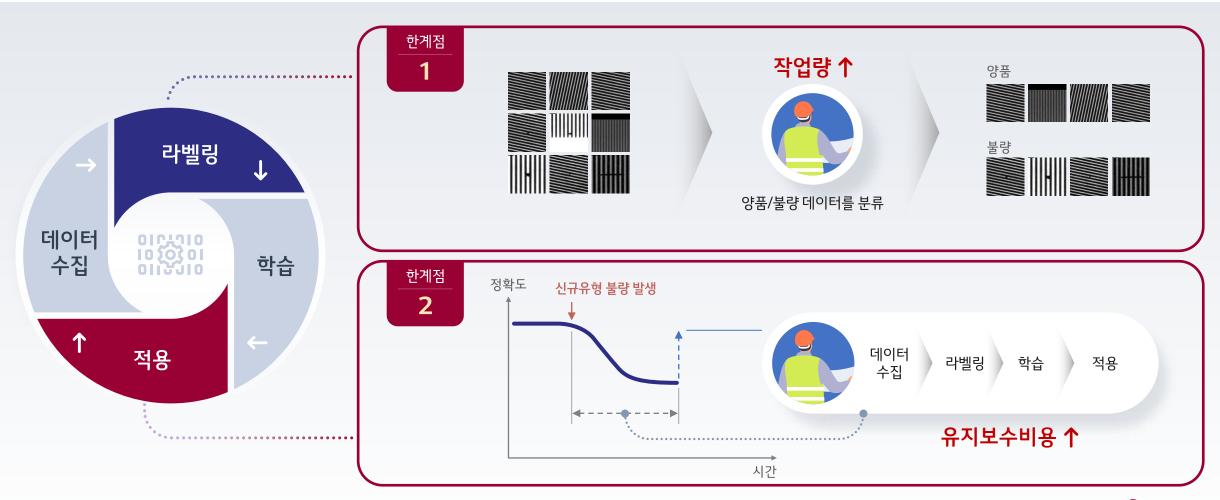


Tape Substrate 제품결함 검사



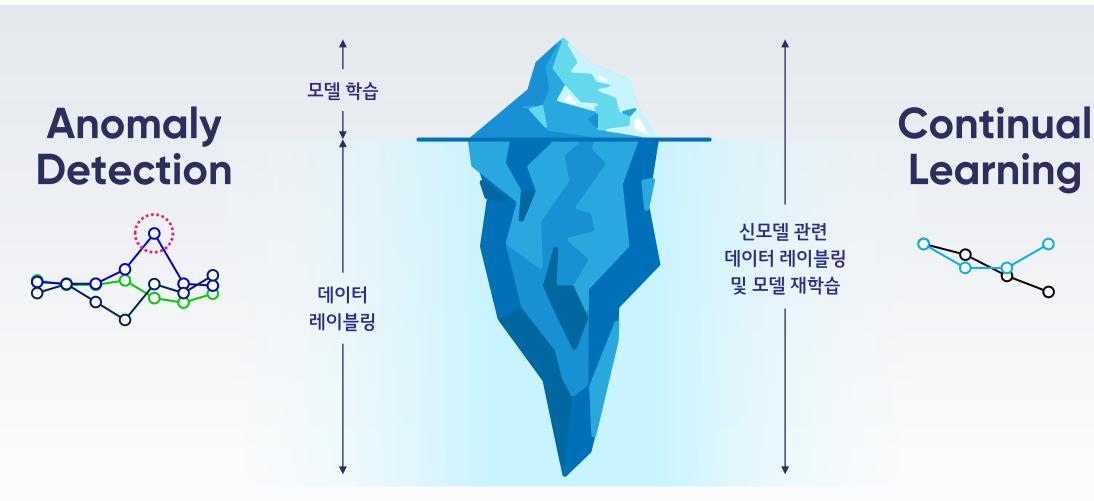
#### **Pain Points**

딥러닝 학습 데이터 수집을 위한 작업량이 많고, 성능 유지를 위해 지속적인 유지 보수 비용이 발생합니다.



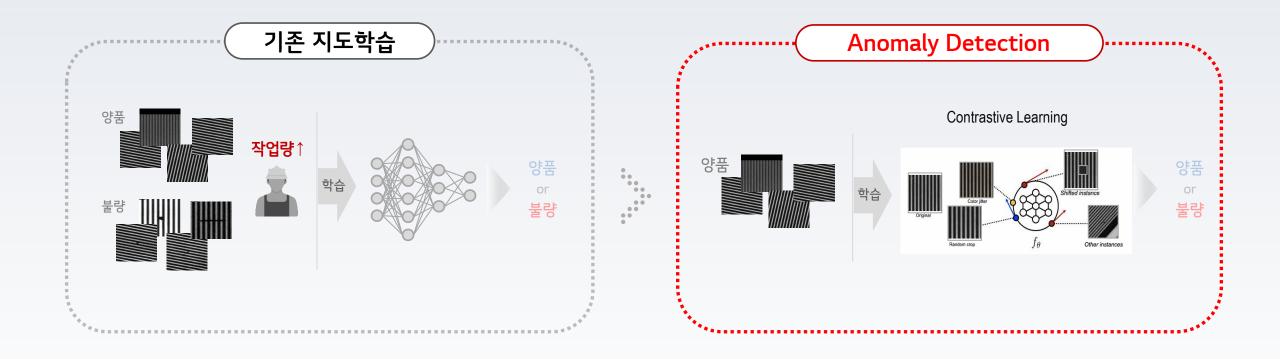
#### **Approches**

양품 데이터만으로 불량을 검출함으로써 데이터 준비 기간을 획기적으로 단축하고, 신모델에 대해서도 스스로 기존 모델과의 차이점만을 재학습하여 판정 정확도를 유지하는 최신 Al 기술을 상용화하였습니다.

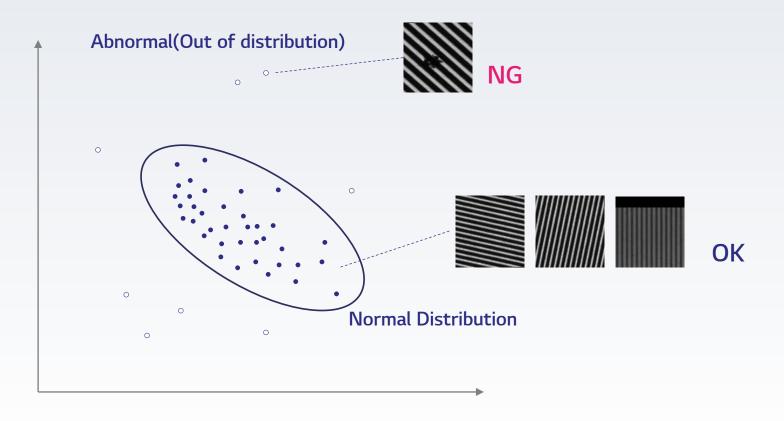




양품 데이터만으로 양품과 불량을 판정할 수 있는 Anomaly Detection 개발을 통해 학습 데이터 준비에 필요한 시간과 노력을 감소시키고자 하였습니다.



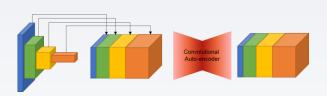
Anomaly Detection이란 Normal 샘플의 분포로부터 벗어난 Abnormal(Out of distribution) 샘플을 찾는 문제로 비전검사에서는 Normal 분포를 양품 데이터의 분포로 정의할 수 있습니다.



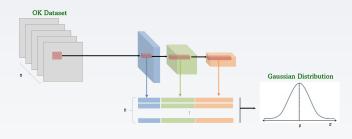


다양한 Approach를 병행 개발하여 성능을 비교하였고, Self-supervised Approach를 통해 우수한 결과를 얻을 수 있었습니다

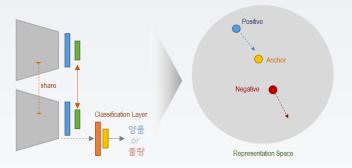
#### **Reconstruction-based**



#### **Density-based**

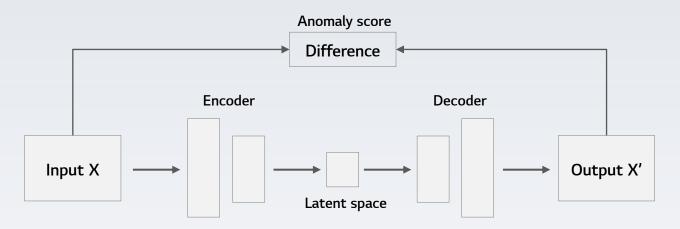


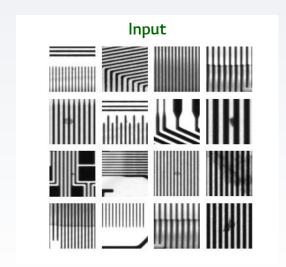
#### **Self-Supervised**

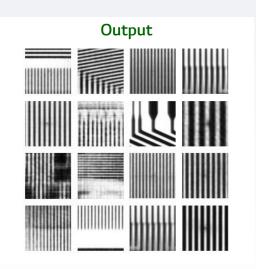


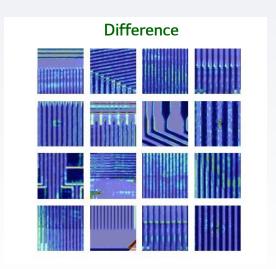


양품 데이터만으로 Auto-encoder를 학습하여 복원하는 방법은 복원 성능 저하로 인해 분류 정확도가 감소되는 문제가 있었습니다.



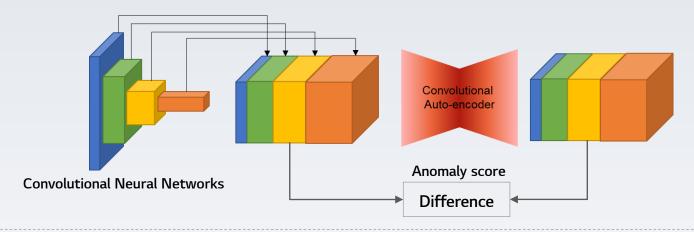


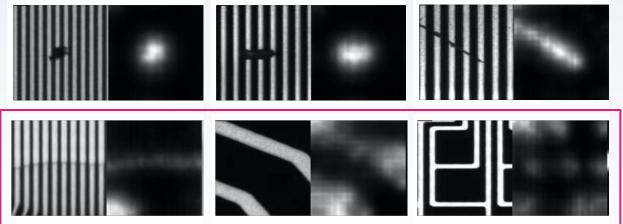






양품 데이터만으로 Auto-encoder를 학습하여 복원하는 방법은 복원 성능 저하로 인해 분류 정확도가 감소되는 문제가 있었습니다.

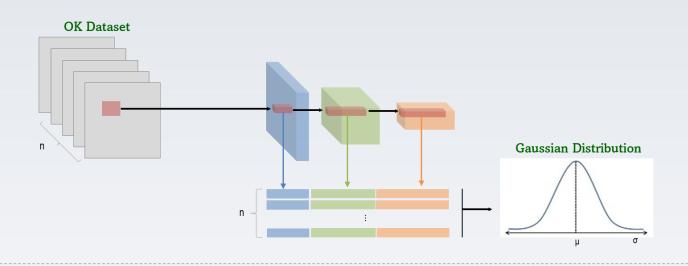




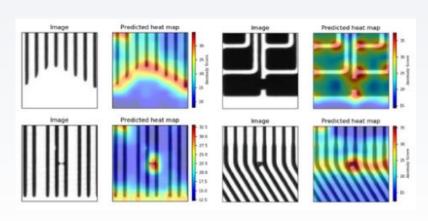
**Reconstruction Error** 



양품의 특징 분포를 모델링하여 분포와의 거리를 측정하는 방법은 데이터셋이 제품의 부분 단위 이미지로 단일 분포 형태를 가지지 못하는 이슈로 성능 저하가 발생하였습니다.



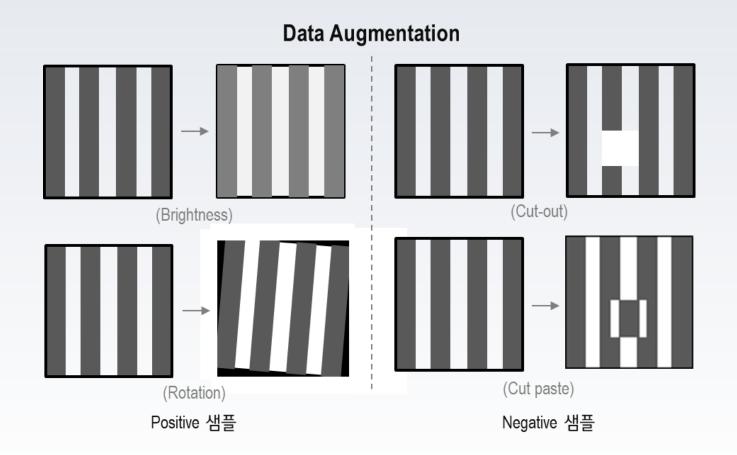




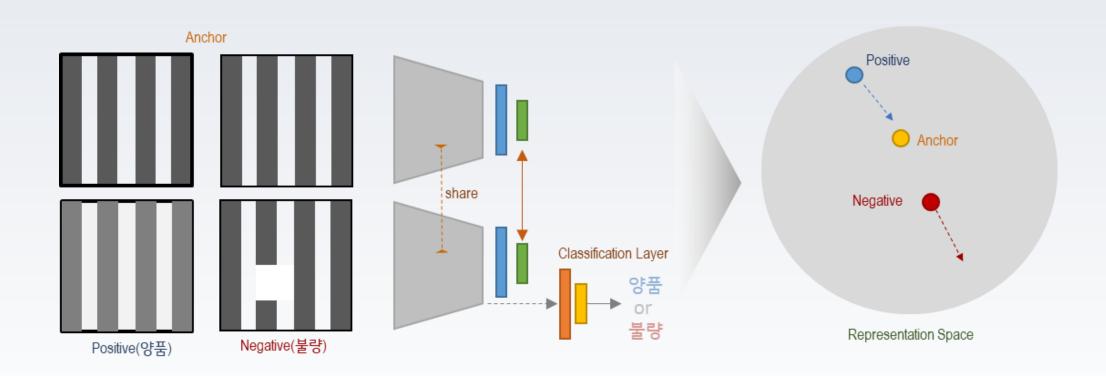
Anomaly Score Error



Contrastive Learning 기반으로 양품 데이터만으로 양품과 불량을 판정할 수 있는 Anomaly Detection 기술개발을 통해 한계점을 극복하였습니다.



Contrastive Learning 기반으로 양품 데이터만으로 양품과 불량을 판정할 수 있는 Anomaly Detection 기술개발을 통해 한계점을 극복하였습니다.



결과

**AUROC** 

88.0

**Supervised Classification** 



0.94

**Anomaly Detection** 

Dataset: 3M

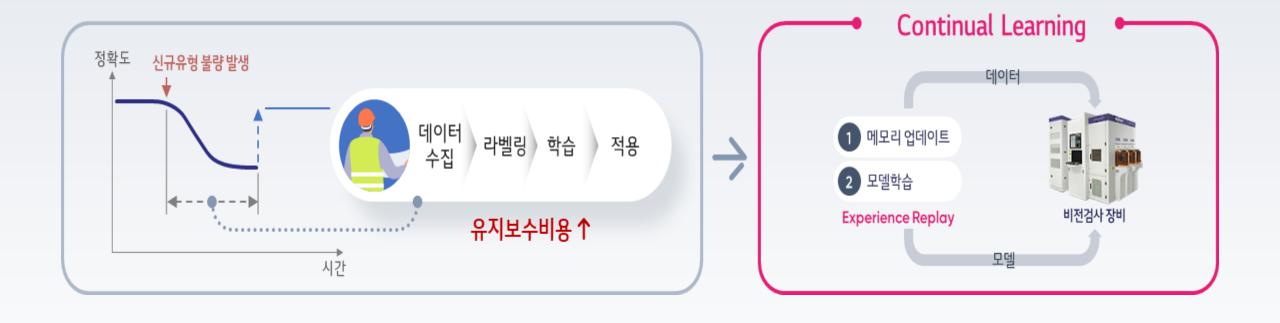


Self-supervised Representation Learning 방법이 산업 현장에서 효과적으로 사용될 수 있음을 확인

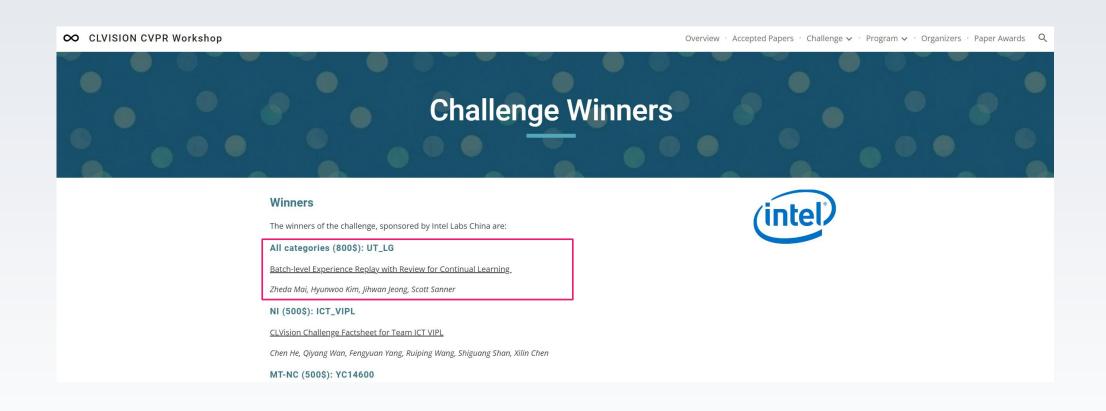
비전검사 분야 특성 상 데이터에 대한 의존도가 높아 제품 데이터에 맞는 Data Augmentation을 선별해야 함



비전검사 딥러닝 분류 모델의 성능을 유지시키기 위한 Continual Learning 기술을 개발하였습니다.

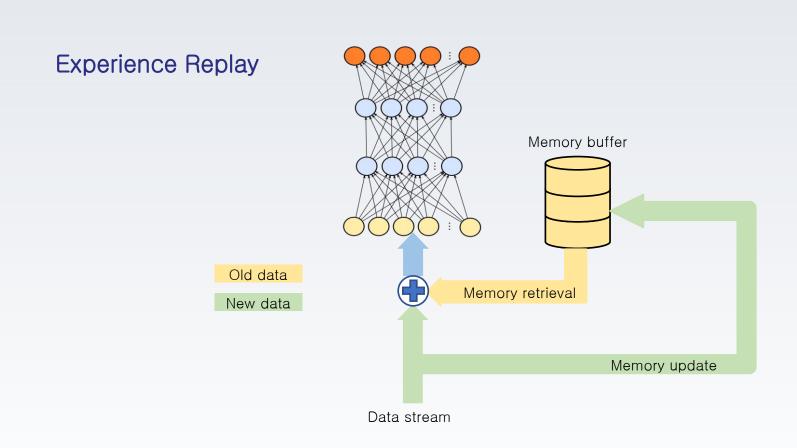


2020년 CVPR Workshop에서 1위를 기록한 알고리즘을 비전검사에 적용하고자 개발을 시도하였습니다.



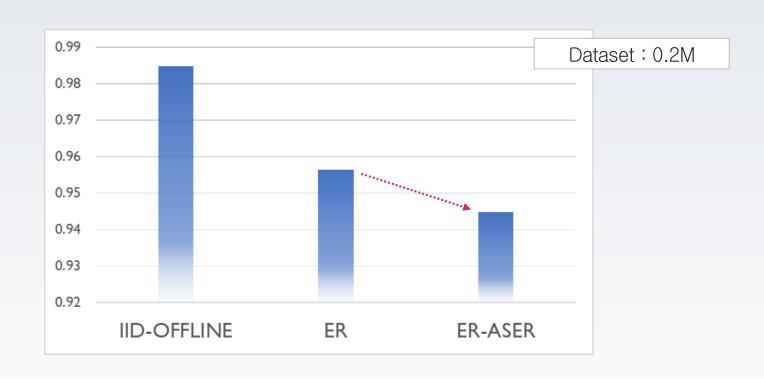


과거의 일부 데이터와 신규 데이터를 함께 학습하는 Experience Replay 방법으로 개발하였으며, 이때 학습에 중요한 정보가 담겨 있는 데이터를 선택하여 메모리 버퍼를 업데이트하는 것이 중요합니다.





ER-ASER 알고리즘을 비전검사 데이터에 적용 시 랜덤하게 데이터를 선택하는 ER 알고리즘 보다 오히려 성능이 저하되는 경향을 보였습니다.





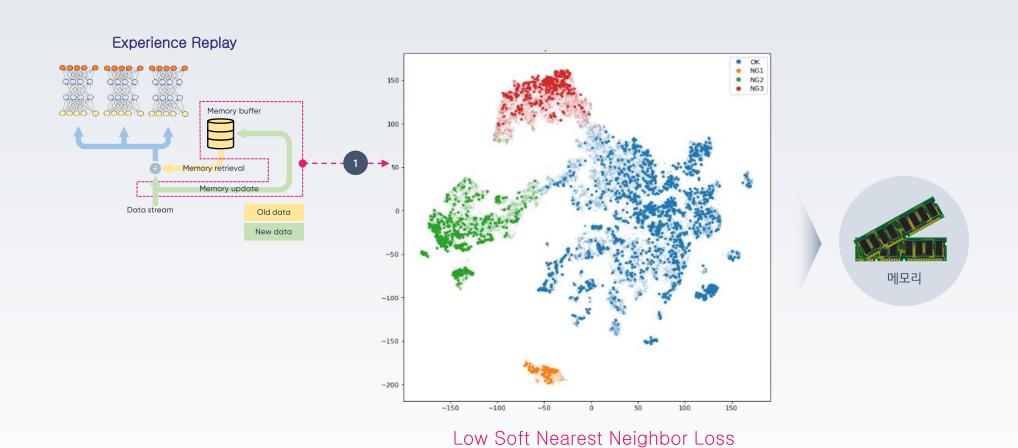
기존 학습된 분류 모델로부터 데이터 셋의 Soft Nearest Neighbor Loss 값을 측정하는 것을 통해 데이터를 선택하도록 하였습니다.



$$snnl_{i}(x, y, T) = -\log \left( \frac{\sum_{\substack{j \in 1...b \\ j \neq i \\ y_{i} = y_{j}}} e^{\frac{-1 + \cos(x_{i}, x_{j})}{T}} }{\sum_{\substack{k \in 1...b \\ k \neq i}} e^{\frac{-1 + \cos(x_{i}, x_{k})}{T}} \right)$$

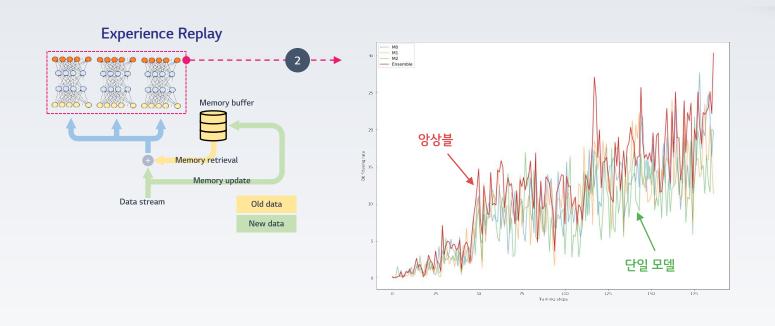


Soft Nearest Neighbor Loss 값이 낮아지는 방향으로 데이터를 선택하여 클래스 별로 응집도가 높은 데이터를 선택하였습니다.





Ensemble 모델을 함께 적용하여 분류 정확도를 개선하였으며, Continual Learning을 적용으로 우수한 결과를 얻을 수 있었습니다.





**AUROC** 

**IID OFFLINE** 

0.929



0.934

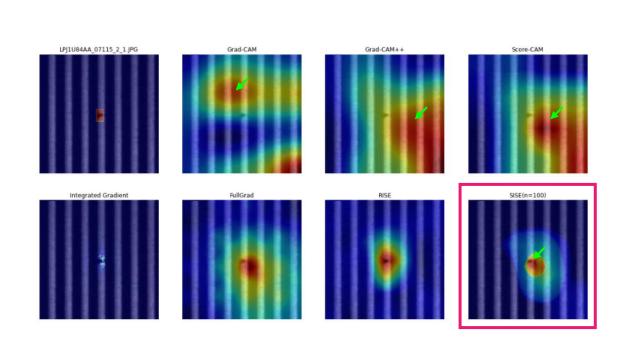
**Continual Learning** 

Dataset: 3M



#### **Explainable Al**

학습된 AI모델에 대한 정량적 신뢰도 확보를 통한 검증 효율화를 위해 Explainable AI 기술을 개발하였습니다.





#### Grad-CAM 대비 EBPG 298% 우수

Grad-CAM: 0.0154 / SISE = 0.0459

#### Grad-CAM 대비 Mask L1 Loss 289% 우수

Grad-CAM: 0.4129 / SISE = 0.1425

Mask L1 Loss = mean (|heatmap - GT\_bbox|)
(0:best, 1:worst)



최신 AI 기술 도입을 통해 ①데이터 준비, ②모델 학습 및 검증, ③실제 제품 검사 단계별 기존 대비 성능을 혁신하여 사업적 Impact를 극대화할 예정입니다.

데이터 준비

**Anomaly Detection** 



모델 학습 및 검증

**Continual Learning / XAI** 

J50% AIT



3

제품 검사

**Anomaly(Novelty) Detection** 

**J37%** 





#### Conclusion

Al기술이 비전검사 특성에 맞추어 실제 산업 현장에 적용될 수 있도록 개발 완료하였고, 사람의 개입을 최소화하고, 검사 정확도를 향상시킬 수 있는 Al 기술을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획입니다.







# LG Al Research

Advancing AI for a better life

